

**COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI**

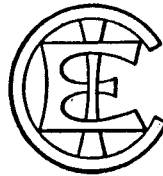
**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD**

Publication 749

Première édition — First edition
1984

Dispositifs à semiconducteurs
Essais mécaniques et climatiques

Semiconductor devices
Mechanical and climatic test methods



© CEI 1984

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Genève, Suisse